PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-215289

(43)Date of publication of application: 25.09.1986

(51)Int.CI.

C30B 25/10 // H01L 21/205

(21)Application number : 60-055217

(71)Applicant: TOSHIBA MACH CO LTD

(22)Date of filing:

19.03.1985 (72)Inventor: GOTO TAISAN

KASHIWAGI NOBUO

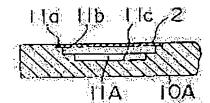
OFICE CALC

SEKIYA ISAO

(54) VAPOR-PHASE GROWTH APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable the uniform heating of a substrate plate, by forming a hollow part formed to a susceptor at a part to hold a substrate plate in a manner to keep a gap between the bottom of the hollow part and the rear surface of the substrate plate excluding the rear surface near the outer circumference of the substrate plate, wherein the gap is set to be larger at the center part of the substrate plate and smaller at the circumferential part. CONSTITUTION: A substrate plate 2 is heated on the susceptor 10A heated in a vapor-phase growth apparatus. The susceptor 10 is furnished with a hollow part 11A composed of a three-stage back facings 11a, 11b, 11c at the part holding the substrate plate 2. The first back facing 11a is formed little larger than the contour of the substrate plate 2. The second back facing 11b is formed concentrically with the first back facing 11a. The contacting part of the substrate plate 2 to the susceptor 10A is restricted to relatively narrow range near the outer circumference and the depth of the second back facing 11b is set to 1 W several mm from the first back facing 11a. The third back facing is also formed concentrically with the other back facings and the depth of the third back facing is set to 1 W several mm from the second back facing.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

®日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-215289

@Int.Cl.4

Ų

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)9月25日

C 30 B 25/10 // H 61 L 21/205

8518-4G 7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 気相成長装置

❷特 顧 昭60-55217

❷出 顧 昭60(1985)3月19日

沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沼津事業所内 伊発 明 者 後 Ш 木 79発 明 者 柏 伸 夫 沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社招津事業所内 個発 顭 者 谷 功 沼津市大岡2068の3 東芝機械株式会社沼津事業所内 東芝機械株式会社 東京都中央区銀座4丁目2番11号 砂出 顧

明 御 書

1. 発明の名称

気相成長装置

2. 特許請求の範囲

1. 加熱されるサセプタに基板を設置して放姜板を加熱する気相成長袋屋にかいて、サセプタの基板設置部分に形成する凹部を、該凹部の底面が少なくとも基板の外周近くの裏面を除く基板裏面に対し 1~15 mm の間隔を有し、かつ該間隔が基板の中心部で大きく外周側は小さくなるように形成したととを特徴とする気相成長袋置。

- 2. 凹部が同心円状の複数段のザグリによって形成されていることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の気相成長装置。
- 3. 四部が曲面になっていることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の気相成長袋量。
- 4. 基板の外周部が熱不良導体を介してサセブタ に設置されるようになっていることを特徴とする 特許館求の範囲第!,2または3項記載の気相成

長袋置。

5. 高板が石英板を介してサセブタに設置される ようになっていることを特徴とする特許請求の範 囲第1,2または3項配載の気相成長袋量。

3. 発明の詳細を説明

(産業上の利用分野)

本発明は、エピタキシャル成長かよび C V D のための気相成長袋壁に係り、特に気相成長を嬉とされる拡板の均一加熱に関するものである。

(従来技術)

(発明が解決しようとする問題点)

1

型が遅く、温度が低くなる傾向にある。しかるに、 サセプタの凹部を前記のように形成したことによ り、基板全体がより均一に加熱され、さらに基板 のそりや凹部の形状の類差などによる影響がほと んどなく、基板間のバラッキも小さく押えられる。 〔実施例〕

 (問題点を解決するための手段)

本発明は、前述したようを問題を解決するため、 サセプタから基板への熱伝達を、接触による熱伝 導を少をくし、熱幅射を主として基板全体をより 均一に加熱するようにしたもので、サセプタの基 板設置部分に形成する凹部を、その底面が少なく とも基板の外周近くの裏面を除く基板裏面に対し 1~15 mm の間隔を有し、かつこの間隔が基板の 中心部で大きく外周側は小さくなるようにしたも のである。

(作用)

本発明の気相成長機健は、凹部の底面と基板の 裏面が外周近くを除いて十分に離れているため。 サセブタから基板への無は、主としてせる。 の輻射光は前配底面の全域から経度一様に発見 の輻射光は前配底面の全域から経度一様に発見 れるが、凹部内にはHzガスや反応ガスなどが侵入 しているため、凹部底面と基板は全体を が小さいほど加熱され易い。他方、基板は全体を 一様に加熱した場合、中心部より外周部の方が昇

また、第3のザクリー| c は、前配第1,第2のザクリー| a・| 1 b と同心円状に設けられ、第2のザクリー b に対して l ないし数 mm の深さになされている。

なお、基板2のそりや凹部!IAの形状顕충による影響を防止するため、凹部.JIAの最も深い部分の底面と基板2の裏面との間隔は1mm以上に

特開昭61-215289 (3)

することが好ましい。ただし、この間隔を大きく し過ぎると、基板 2 の温度低下が大きくエネルギー損失につながるため、1 5 mm 程度に止めることが 好ましい。

また、基板2の大きさや厚さの関係などから第1のザグリ 1 1 a の部分にかける基板2 との接触により外周部が強く加熱され過ぎる場合には、設第1のザグリ 1 1 a をテーパ状にして、基板2の最外周部を競扱とするか、または第3 図に示すように、サセブタ 1 0 B に凹部 1 1 B を形成すると共に無不良導体である石英や Si3 N4 などのセラミックスのリングあるいは突起(図示せず)などからなる支持体12を介在させるとよい。

また、凹部は、第4図に示すように、深さが連続的に変化する曲面状の凹部 | | C としてもよい。さらにまた、第5図に示すように、凹部 | | D 内に石英板 | 3を設けても、この石英板 | 3は輻射光を透過し、かつ石英板 | 3を介して行なわれる熱伝導は、石英が熱の不良導体であるために小さく押えられ、単なる空間の場合と同様の効果が得

断面図、第6図および第7図は従来装置のそれぞれ異なる例を示す要部断面図、第8図は従来装置による場合のスリップ発生状態を示す基板の平面図である。

2 ······ 基板、 10A · 10B · 10C · 10D ····· サセブタ、
11A · 11B · 11C · 11D ······ 四部、 12 ······ 支持体、
13 ······ 石英板。

出版人 東芝機械株式会社

られる。さらに石英板 | 3 は熱保持性が良いため、高風における基板 2 の風度安定性を向上させる効果が得られる。なお、第 5 図に示した石英板 | 3 は凹部 | | D の金体を埋めるように形成されているが、これに限らず基板 2 に沿う単なる平面状のものとしてもよい。

(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、基板のそりやサセブタの表面状態などによる影響を押えて基板全体をより均一に加熱でき、さらに基板の加熱を主としてサセブタからの輻射光で行なりため、基板がシリコンのように輻射光の一部を透過する材質である場合には、裏面のみならず、内部やよび表面側も透過してくる輻射光によって加熱され、厚さ方向の温度の均一化もはかることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例を示す要部断面図、 第2図はサセブタの凹部底面と基板裏面との間隔 と基板温度の関係を示す曲線図、第3図ないし第 5図は本発明のそれぞれ異なる実施例を示す要部

